

1. Record Nr.	UNISA996281106603316
Titolo	2006 IEEE International Test Conference : Santa Clara, CA : 22-27 October 2006
Pubbl/distr/stampa	IEEE
ISBN	1-5090-9088-6
Disciplina	621.3815/48
Soggetti	Integrated circuits - Testing Electronic digital computers - Circuits - Testing Telecommunication Radio frequency
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia